



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р**

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ 18604.0—83 (СТ СЭВ 1622—79), ГОСТ 18604.1—80
(СТ СЭВ 3993—83), ГОСТ 18604.2—80 (СТ СЭВ 4288—83),
ГОСТ 18604.3—80 (СТ СЭВ 3999—83), ГОСТ 18604.4—74
(СТ СЭВ 3998—83), ГОСТ 18604.5—74 (СТ СЭВ 3998—83),
ГОСТ 18604.6—74 (СТ СЭВ 3998—83), ГОСТ 18604.7—74,
ГОСТ 18604.8—74, ГОСТ 18604.9—82, ГОСТ 18604.10—76,
ГОСТ 18604.11—76 (СТ СЭВ 3996—83), ГОСТ 18604.13—77,
ГОСТ 18604.14—77, ГОСТ 18604.15—77, ГОСТ 18604.16—78—
ГОСТ 18604.19—78, ГОСТ 18604.20—78 (СТ СЭВ 3996—83),
ГОСТ 18604.22—78 (СТ СЭВ 4289—83),
ГОСТ 18604.23—80, ГОСТ 18604.24—81

Издание официальное

Цена 50 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

Общие требования при измерении
электрических параметровГОСТ
18604.0—83Bipolar transistors General requirements for measuring
of electrical parameters

(СТ СЭВ 1622—79)

ОКП 62 2312

Взамен
ГОСТ 18604.0—74**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 августа
1983 г. № 3949 срок действия установлен****с 01.07.84****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзисторы (далее — транзисторы) и устанавливает общие требования к условиям измерений, аппаратуре и показателям точности измерений.

Стандарт следует применять совместно с соответствующими стандартами комплекса при разработке измерительной аппаратуры и проведении измерений электрических параметров биполярных транзисторов.

Конкретные требования к правилам измерения отдельных параметров транзисторов должны быть приведены в стандартах на методы измерения этих параметров или в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Содержание стандартов комплекса должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 8 010—72.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1622—79.

1. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Измерение параметров транзисторов следует проводить в условиях, установленных в стандартах на конкретные методы измерения, стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов или в программах испытаний.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена***Переиздание декабрь 1985 г*

1.2. Режим питания транзисторов должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При отсутствии стандартов или технических условий на конкретные типы транзисторов режим питания устанавливается в программах испытаний.

1.3. Измерение параметров транзисторов производят в режимах большого или малого сигнала, что должно быть указано в стандартах на конкретные методы измерения. Сигнал считается малым, если при уменьшении амплитуды сигнала в два раза значение измеряемого параметра изменится менее чем на значение основной погрешности измерительной установки.

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерительные приборы и установки, предназначенные для измерения параметров транзисторов, должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261—82 и стандартов, утвержденных в установленном порядке.

2.2. Места подключения измерительных приборов для контроля режима питания транзисторов могут отличаться от указанных на схемах установок, приведенных в соответствующих стандартах на методы измерения, но должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.3. Измерительные приборы для контроля режима питания транзисторов могут отсутствовать, если при этом обеспечивается требуемая точность задания и поддержания режима. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.4. Для защиты транзисторов от перегрузок, возможных при воздействии переходных процессов, статического электричества или паразитного самовозбуждения, измерительные установки должны быть снабжены устройствами защиты, исключающими возможность превышения предельно допустимых электрических режимов, установленных в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов. При этом основная погрешность установок должна быть в пределах, установленных в стандартах на конкретные методы измерения.

2.5. Полярность источников питания электроизмерительных приборов и измеряемого транзистора указывают в структурных схемах измерительных установок, приведенных в стандартах на методы измерения.

2.6. Электроизмерительные приборы и диапазон измерений выбирают так, чтобы отсчет измеряемого параметра производился в последних $\frac{2}{3}$ шкалы. Этот интервал считают ее рабо-